

SN74AHCT244-Q1 車載用、3ステート出力のオクタルバッファ / ドライバ

1 特長

- 車載アプリケーション認定済み
- 1000V (MIL-STD-883, method 3015) を超える ESD 保護
- EPIC™ (Enhanced-Performance Implanted CMOS) プロセス
- 入力は TTL 電圧互換

2 アプリケーション

- デジタル信号のイネーブルまたはディスエーブル
- 低速またはノイズの多い入力信号の除去
- コントローラ・リセット時の信号保持
- スイッチのデバウンス

3 概要

このオクタルバッファ / ドライバは、3ステートメモリアドレスドライバ、クロックドライバ、バス用レシーバ / トランシッタの性能と密度の両方が向上するよう特に設計されています。

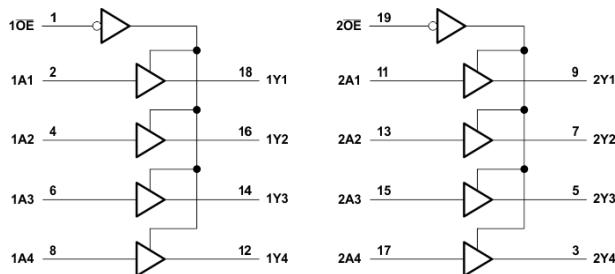
パッケージ情報

部品番号	パッケージ ⁽¹⁾	パッケージサイズ ⁽²⁾	本体サイズ ⁽³⁾
SN74AHCT244-Q1	DW (SOIC, 20)	12.80mm × 10.3mm	12.8mm × 7.5mm
	PW (TSSOP, 20)	6.50mm × 6.4mm	6.50mm × 4.40mm

(1) 詳細については、[セクション 11](#) を参照してください。

(2) パッケージサイズ(長さ×幅)は公称値であり、該当する場合はピンも含まれます。

(3) 本体サイズ(長さ×幅)は公称値であり、ピンは含まれません。



論理図(正論理)



このリソースの元の言語は英語です。翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール(機械翻訳)を使用していることがあり、TIでは翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。実際の設計などの前には、ti.comで必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。

English Data Sheet: [SCLS529](#)

Table of Contents

1 特長.....	1	7.2 Functional Block Diagram.....	7
2 アプリケーション.....	1	7.3 Device Functional Mode.....	7
3 概要.....	1	8 Application and Implementation.....	8
4 Pin Configuration and Functions.....	3	8.1 Power Supply Recommendations.....	8
5 Specifications.....	4	8.2 Layout.....	8
5.1 Absolute Maximum Ratings	4	9 Device and Documentation Support.....	10
5.2 ESD Ratings.....	4	9.1 Documentation Support.....	10
5.3 Recommended Operating Conditions.....	4	9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法.....	10
5.4 Thermal Information.....	4	9.3 サポート・リソース.....	10
5.5 Electrical Characteristics.....	5	9.4 Trademarks.....	10
5.6 Switching Characteristics.....	5	9.5 静電気放電に関する注意事項.....	10
5.7 Noise Characteristics.....	5	9.6 用語集.....	10
5.8 Operating Characteristics.....	5	10 Revision History.....	10
6 Parameter Measurement Information.....	6	11 Mechanical, Packaging, and Orderable	
7 Detailed Description.....	7	Information.....	11
7.1 Overview.....	7		

4 Pin Configuration and Functions

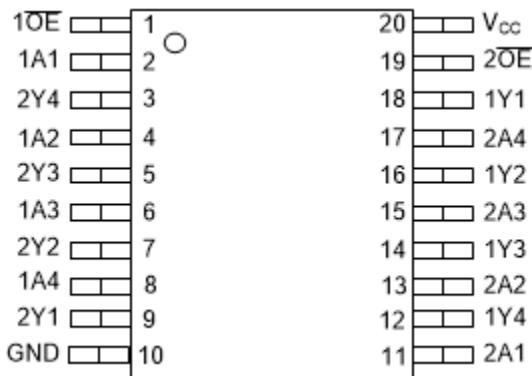


図 4-1. DW or PW Package (Top View)

表 4-1. Pin Functions

PIN		I/O	DESCRIPTION
NO.	NAME		
1	1 OĒ	I	Output Enable 1
2	1A1	I	1A1 Input
3	2Y4	O	2Y4 Output
4	1A2	I	1A2 Input
5	2Y3	O	2Y3 Output
6	1A3	I	1A3 Input
7	2Y2	O	2Y2 Output
8	1A4	I	1A4 Input
9	2Y1	O	2Y1 Output
10	GND	—	Ground pin
11	2A1	I	2A1 Input
12	1Y4	O	1Y4 Output
13	2A2	I	2A2 Input
14	1Y3	O	1Y3 Output
15	2A3	I	2A3 Input
16	1Y2	O	1Y2 Output
17	2A4	I	2A4 Input
18	1Y1	O	1Y1 Output
19	2 OĒ	I	Output Enable 2
20	VCC	—	Power Pin

5 Specifications

5.1 Absolute Maximum Ratings

over operating free-air temperature range (unless otherwise noted)

		MIN	MAX	UNIT
V _{CC}	Supply voltage range	-0.5	7	V
V _I ⁽¹⁾	Input voltage range	-0.5	7	V
V _O ⁽¹⁾	Output voltage range	-0.5	V _{CC} + 0.5	V
I _{IK} (V _I < 0)	Input clamp current		-20	mA
I _{OK} (V _O < 0 or V _O > V _{CC})	Output clamp current		±20	mA
I _O (V _O = 0 to V _{CC})	Continuous output current		±25	mA
	Continuous current through V _{CC} or GND		±75	mA
T _{stg}	Storage temperature range	-65	150	°C

(1) The input and output voltage ratings may be exceeded if the input and output current ratings are observed.

Stresses beyond those listed under "absolute maximum ratings" may cause permanent damage to the device.

These are stress ratings only, and functional operation of the device at these or any other conditions beyond those indicated under "recommended operating conditions" is not implied. Exposure to absolute-maximum-rated conditions for extended periods may affect device reliability.

5.2 ESD Ratings

		MIN	MAX	UNIT
V _(ESD)	Electrostatic discharge	Human body model (HBM), per ANSI/ESDA/JEDEC JS-001, all pins ⁽¹⁾	0	1500
		Charged device model (CDM), per JEDEC specification JESD22-C101, all pins ⁽²⁾	0	2000

(1) JEDEC document JEP155 states that 500-V HBM allows safe manufacturing with a standard ESD control process.

(2) JEDEC document JEP157 states that 250-V CDM allows safe manufacturing with a standard ESD control process.

5.3 Recommended Operating Conditions

(over operating free-air temperature range (unless otherwise noted)⁽¹⁾)

		MIN	MAX	UNIT
V _{CC}	Supply voltage	4.5	5.5	V
V _{IH}	High-level input voltage	2		V
V _{IL}	Low-level input voltage		0.8	V
V _I	Input voltage	0	5.5	V
V _O	Output voltage	0	V _{CC}	V
I _{OH}	High-level output current		-8	mA
I _{OL}	Low-level output current		8	mA
T _A	Operating free-air temperature	I-suffix device	-40	85
		Q-suffix device	-40	125

(1) All unused inputs of the device must be held at V_{CC} or GND to ensure proper device operation. Refer to the TI application report, *Implications of Slow or Floating CMOS Inputs*, literature number SCBA004.

5.4 Thermal Information

THERMAL METRIC ⁽¹⁾		SN74AHCT244-Q1		UNIT
		DW	PW	
		20 PINS		
R _{θJA}	Junction-to-ambient thermal resistance	58	116.8	°C/W

(1) For more information about traditional and new thermal metrics, see the *IC Package Thermal Metrics* application report, [SPRA953](#).

5.5 Electrical Characteristics

over recommended operating free-air temperature range (unless otherwise noted)

PARAMETER	TEST CONDITIONS	V _{CC}	T _A = 25°C			MIN	MAX	UNIT
			MIN	TYP	MAX			
V _{OH}	I _{OH} = -50 mA	4.5 V	4.4	4.5	4.4	4.4	3.8	V
	I _{OH} = -8 mA		3.94					
V _{OL}	I _{OL} = 50 mA	4.5 V		0.1		0.1	0.44	V
	I _{OL} = 8 mA			0.36				
I _{OZ}	V _O = V _{CC} or GND	5.5 V		±0.25		±0.25	±2.5	µA
I _I	V _I = 5.5 V or GND	0 V to 5.5 V		±0.1		±0.1	±1	µA
I _{CC}	V _I = V _{CC} or GND, I _O = 0	5.5 V		4		4	40	µA
ΔI _{CC} ⁽¹⁾	One input at 3.4 V, Other inputs at V _{CC} or GND	5.5 V		1.35		1.35	1.5	µA
C _i	V _I = V _{CC} or GND	5 V		2.5	10			pF
C _o	V _O = V _{CC} or GND	5 V		3				pF

(1) This is the increase in supply current for each input at one of the specified TTL voltage levels, rather than 0 V or V_{CC}.

5.6 Switching Characteristics

over recommended operating free-air temperature range, V_{CC} = 5 V ± 0.5 V (unless otherwise noted) (see [图 6-1](#))

PARAMETER	FROM (INPUT)	TO (OUTPUT)	LOAD CAPACITANCE	T _A = 25°C			MIN	MAX	UNIT
				MIN	TYP	MAX			
t _{PLH}	A	Y	C _L = 15 pF	5.4	7.4	1	8.5		ns
t _{PHL}				5.4	7.4	1	8.5		
t _{PZH}	OE	Y	C _L = 15 pF	7.7	10.4	1	12		ns
t _{PZL}				7.7	10.4	1	12		
t _{PHZ}	OE	Y	C _L = 15 pF	5	9.4	1	10		ns
t _{PLZ}				5	9.4	1	10		
t _{PLH}	A	Y	C _L = 50 pF	5.9	8.4	1	9.5		ns
t _{PHL}				5.9	8.4	1	9.5		
t _{PZH}	OE	Y	C _L = 50 pF	8.2	11.4	1	13		ns
t _{PZL}				8.2	11.4	1	13		
t _{PHZ}	OE	Y	C _L = 50 pF	8.8	11.4	1	13		ns
t _{PLZ}				8.8	11.4	1	13		
t _{sk(o)}			C _L = 50 pF		1				ns

5.7 Noise Characteristics

V_{CC} = 5 V, C_L = 50 pF, T_A = 25°C ⁽¹⁾

PARAMETER	MIN	TYP	MAX	UNIT
V _{OH(V)} Quiet output, minimum dynamic V _{OH}		4.1		V
V _{IH(D)} High-level dynamic input voltage	2			V
V _{IL(D)} Low-level dynamic input voltage		0.8		V

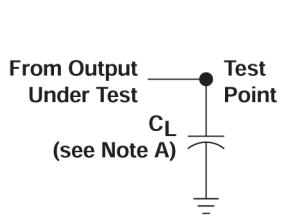
(1) Characteristics are for surface-mount packages only.

5.8 Operating Characteristics

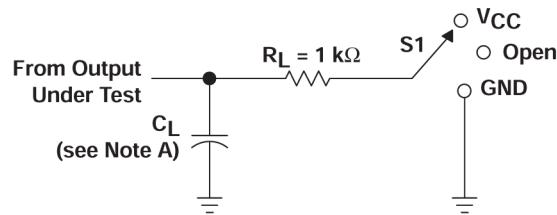
V_{CC} = 5 V, T_A = 25°C

PARAMETER	TEST CONDITIONS	TYP	UNIT
C _{pd} Power dissipation capacitance	No load, f = 1 MHz	8.2	pF

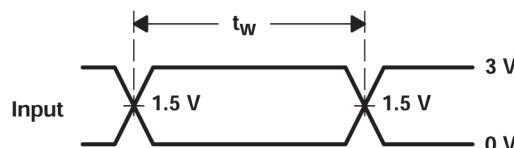
6 Parameter Measurement Information



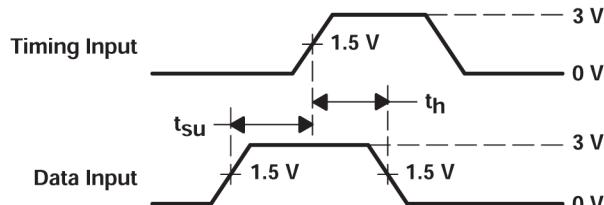
LOAD CIRCUIT FOR
TOTEM-POLE OUTPUTS



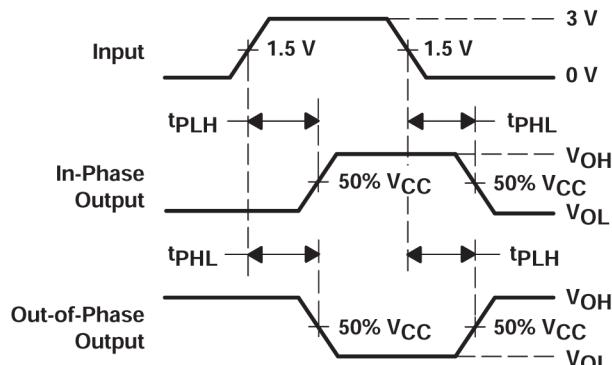
LOAD CIRCUIT FOR
3-STATE AND OPEN-DRAIN OUTPUTS



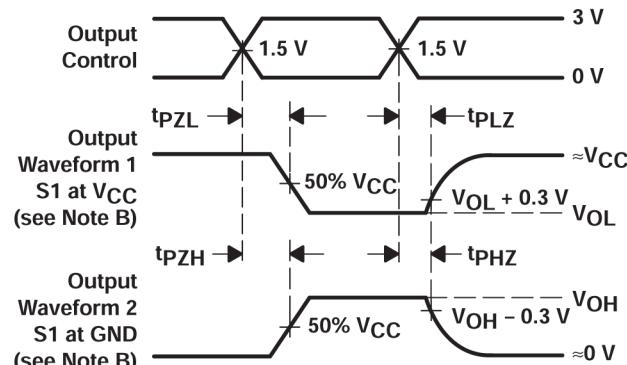
VOLTAGE WAVEFORMS
PULSE DURATION



VOLTAGE WAVEFORMS
SETUP AND HOLD TIMES



VOLTAGE WAVEFORMS
PROPAGATION DELAY TIMES
INVERTING AND NONINVERTING OUTPUTS



VOLTAGE WAVEFORMS
ENABLE AND DISABLE TIMES
LOW- AND HIGH-LEVEL ENABLING

- A. C_L includes probe and jig capacitance.
- B. Waveform 1 is for an output with internal conditions such that the output is low, except when disabled by the output control. Waveform 2 is for an output with internal conditions such that the output is high, except when disabled by the output control.
- C. All input pulses are supplied by generators having the following characteristics: $PRR \leq 1 \text{ MHz}$, $Z_O = 50 \Omega$, $t_r \leq 3 \text{ ns}$, $t_f \leq 3 \text{ ns}$.
- D. The outputs are measured one at a time, with one input transition per measurement.

図 6-1. Load Circuit and Voltage Waveforms

TEST	S1
t_{PLH}/t_{PHL}	Open
t_{PLZ}/t_{PZL}	V_{CC}
t_{PHZ}/t_{PZH}	GND
Open Drain	V_{CC}

7 Detailed Description

7.1 Overview

The SN74AHCT244 is organized as two 4-bit buffers/line drivers with separate output-enable (\overline{OE}) inputs. When \overline{OE} is low, the device passes data from the A inputs to the Y outputs. When \overline{OE} is high, the outputs are in the high-impedance state.

To ensure the high-impedance state during power up or power down, \overline{OE} shall be tied to V_{CC} through a pullup resistor; the minimum value of the resistor is determined by the current-sinking capability of the driver.

7.2 Functional Block Diagram

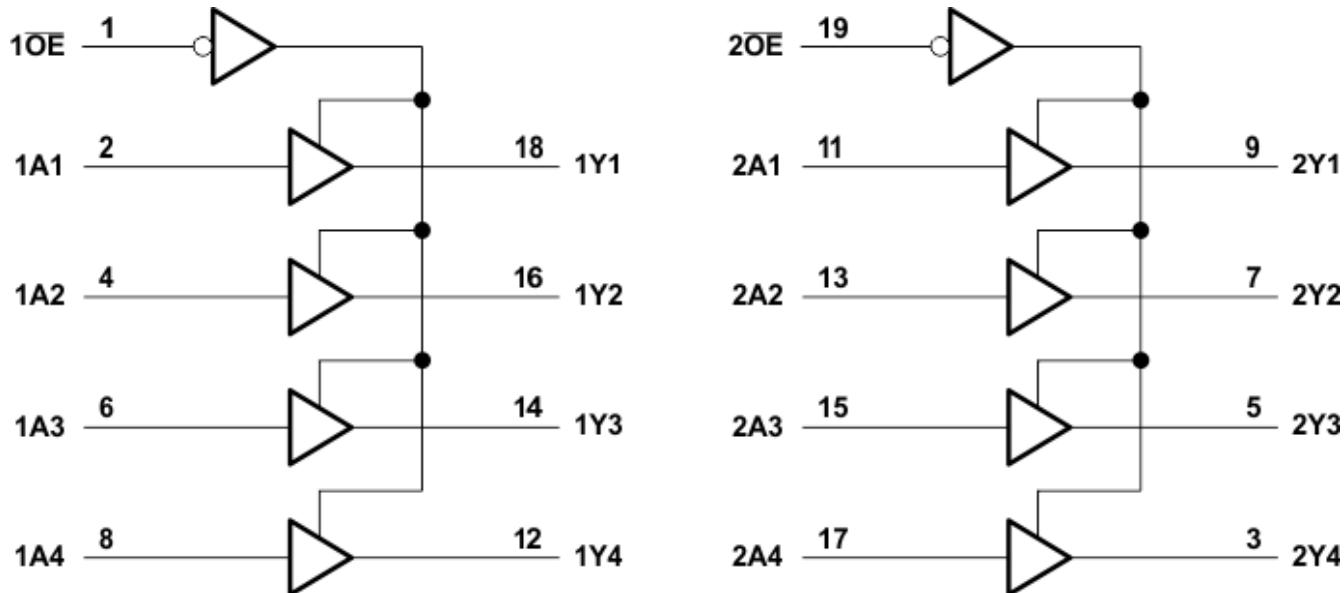


図 7-1. Logic Diagram (Positive Logic)

7.3 Device Functional Mode

表 7-1. (Each 4-Bit Buffer/Driver)

INPUTS		OUTPUT Y
\overline{OE}	A	
L	H	H
L	L	L
H	X	Z

8 Application and Implementation

注

以下のアプリケーション情報は、TI の製品仕様に含まれるものではなく、TI ではその正確性または完全性を保証いたしません。個々の目的に対する製品の適合性については、お客様の責任で判断していただくことになります。お客様は自身の設計実装を検証しテストすることで、システムの機能を確認する必要があります。

8.1 Power Supply Recommendations

The power supply can be any voltage between the MIN and MAX supply voltage rating located in the [セクション 5.3](#) table.

Each VCC pin should have a good bypass capacitor to prevent power disturbance. For devices with a single supply, 0.1 μ F is recommended; if there are multiple VCC pins, then 0.01 μ F or 0.022 μ F is recommended for each power pin. It is acceptable to parallel multiple bypass caps to reject different frequencies of noise. A 0.1 μ F and a 1 μ F are commonly used in parallel. The bypass capacitor should be installed as close to the power pin as possible for best results.

8.2 Layout

8.2.1 Layout Guidelines

When using multiple-bit logic devices, inputs should never float.

In many cases, functions or parts of functions of digital logic devices are unused, for example, when only two inputs of a triple-input AND gate are used or only 3 of the 4 buffer gates are used. Such input pins should not be left unconnected because the undefined voltages at the outside connections result in undefined operational states. [セクション 8.2.1.1](#) specifies the rules that must be observed under all circumstances. All unused inputs of digital logic devices must be connected to a high or low bias to prevent them from floating. The logic level that should be applied to any particular unused input depends on the function of the device. Generally they will be tied to GND or V_{CC}, whichever makes more sense or is more convenient. It is generally acceptable to float outputs, unless the part is a transceiver. If the transceiver has an output enable pin, it will disable the output section of the part when asserted. This will not disable the input section of the I/Os, so they cannot float when disabled.

8.2.1.1 Layout Example

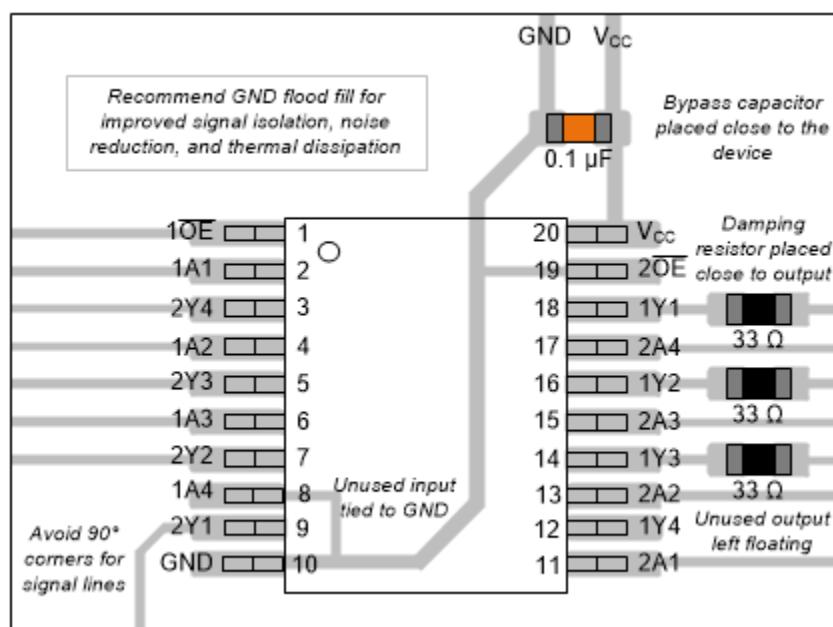


図 8-1. Layout Diagram

9 Device and Documentation Support

9.1 Documentation Support

9.1.1 Related Documentation

The table below lists quick access links. Categories include technical documents, support and community resources, tools and software, and quick access to sample or buy.

表 9-1. Related Links

PARTS	PRODUCT FOLDER	SAMPLE & BUY	TECHNICAL DOCUMENTS	TOOLS & SOFTWARE	SUPPORT & COMMUNITY
SN74AHCT244-Q1	Click here				

9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法

ドキュメントの更新についての通知を受け取るには、www.tij.co.jp のデバイス製品フォルダを開いてください。[通知] をクリックして登録すると、変更されたすべての製品情報に関するダイジェストを毎週受け取ることができます。変更の詳細については、改訂されたドキュメントに含まれている改訂履歴をご覧ください。

9.3 サポート・リソース

テキサス・インスツルメンツ E2E™ サポート・フォーラムは、エンジニアが検証済みの回答と設計に関するヒントをエキスパートから迅速かつ直接得ることができる場所です。既存の回答を検索したり、独自の質問をしたりすることで、設計で必要な支援を迅速に得ることができます。

リンクされているコンテンツは、各寄稿者により「現状のまま」提供されるものです。これらはテキサス・インスツルメンツの仕様を構成するものではなく、必ずしもテキサス・インスツルメンツの見解を反映したものではありません。テキサス・インスツルメンツの使用条件を参照してください。

9.4 Trademarks

テキサス・インスツルメンツ E2E™ is a trademark of Texas Instruments.

すべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

9.5 静電気放電に関する注意事項



この IC は、ESD によって破損する可能性があります。テキサス・インスツルメンツは、IC を取り扱う際には常に適切な注意を払うことをお勧めします。正しい取り扱いおよび設置手順に従わない場合、デバイスを破損するおそれがあります。

ESD による破損は、わずかな性能低下からデバイスの完全な故障まで多岐にわたります。精密な IC の場合、パラメータがわずかに変化するだけで公表されている仕様から外れる可能性があるため、破損が発生しやすくなっています。

9.6 用語集

[テキサス・インスツルメンツ用語集](#) この用語集には、用語や略語の一覧および定義が記載されています。

10 Revision History

資料番号末尾の英字は改訂を表しています。その改訂履歴は英語版に準じています。

Changes from Revision D (April 2023) to Revision E (August 2024)	Page
• データシート全体にわたってマシン モデルへの参照を削除.....	1
• 「パッケージ情報」表にパッケージ サイズを追加.....	1
• Updated R _{θJA} values: PW = 83 to 116.8, all values in °C/W	4

Changes from Revision C (April 2008) to Revision D (April 2023)	Page
• 「アプリケーション」、「パッケージ情報」表、「ピンの機能」表、「ESD 定格」表、「熱に関する情報」表、「デバイスの機能モード」、「アプリケーションと実装」セクション、「電源に関する推奨事項」セクション、「レイアウト」セクション、「デバイスおよびドキュメントのサポート」セクション、および「メカニカル、パッケージ、および注文情報」セクションを追加	1

11 Mechanical, Packaging, and Orderable Information

The following pages include mechanical, packaging, and orderable information. This information is the most current data available for the designated devices. This data is subject to change without notice and revision of this document. For browser-based versions of this data sheet, refer to the left-hand navigation.

重要なお知らせと免責事項

テキサス・インスツルメンツは、技術データと信頼性データ（データシートを含みます）、設計リソース（リファレンス デザインを含みます）、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の默示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または默示的にかかわらず拒否します。

これらのリソースは、テキサス・インスツルメンツ製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したものです。(1) お客様のアプリケーションに適した テキサス・インスツルメンツ製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションに該当する各種規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとします。

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されている テキサス・インスツルメンツ製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、テキサス・インスツルメンツはその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。テキサス・インスツルメンツや第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、テキサス・インスツルメンツおよびその代理人を完全に補償するものとし、テキサス・インスツルメンツは一切の責任を拒否します。

テキサス・インスツルメンツの製品は、[テキサス・インスツルメンツの販売条件](#)、または [ti.com](#) やかかる テキサス・インスツルメンツ製品の関連資料などのいづれかを通じて提供する適用可能な条項の下で提供されています。テキサス・インスツルメンツがこれらのリソースを提供することは、適用されるテキサス・インスツルメンツの保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案した場合でも、テキサス・インスツルメンツはそれらに異議を唱え、拒否します。

郵送先住所: Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265

Copyright © 2024, Texas Instruments Incorporated

PACKAGING INFORMATION

Orderable Device	Status (1)	Package Type	Package Drawing	Pins	Package Qty	Eco Plan (2)	Lead finish/ Ball material (6)	MSL Peak Temp (3)	Op Temp (°C)	Device Marking (4/5)	Samples
CAHCT244IPWRG4Q1	ACTIVE	TSSOP	PW	20	2000	RoHS & Green	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	AHCT244I	Samples
CAHCT244QDWRG4Q1	ACTIVE	SOIC	DW	20	2000	RoHS & Green	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	AHCT244Q	Samples
CAHCT244QPWRG4Q1	ACTIVE	TSSOP	PW	20	2000	RoHS & Green	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	AHCT244Q	Samples
SN74AHCT244IPWRQ1	ACTIVE	TSSOP	PW	20	2000	RoHS & Green	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	AHCT244I	Samples
SN74AHCT244QDWRQ1	ACTIVE	SOIC	DW	20	2000	RoHS & Green	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	AHCT244Q	Samples
SN74AHCT244QPWRQ1	ACTIVE	TSSOP	PW	20	2000	RoHS & Green	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	AHCT244Q	Samples

(1) The marketing status values are defined as follows:

ACTIVE: Product device recommended for new designs.

LIFEBUY: TI has announced that the device will be discontinued, and a lifetime-buy period is in effect.

NRND: Not recommended for new designs. Device is in production to support existing customers, but TI does not recommend using this part in a new design.

PREVIEW: Device has been announced but is not in production. Samples may or may not be available.

OBSOLETE: TI has discontinued the production of the device.

(2) **RoHS:** TI defines "RoHS" to mean semiconductor products that are compliant with the current EU RoHS requirements for all 10 RoHS substances, including the requirement that RoHS substance do not exceed 0.1% by weight in homogeneous materials. Where designed to be soldered at high temperatures, "RoHS" products are suitable for use in specified lead-free processes. TI may reference these types of products as "Pb-Free".

RoHS Exempt: TI defines "RoHS Exempt" to mean products that contain lead but are compliant with EU RoHS pursuant to a specific EU RoHS exemption.

Green: TI defines "Green" to mean the content of Chlorine (Cl) and Bromine (Br) based flame retardants meet JS709B low halogen requirements of <=1000ppm threshold. Antimony trioxide based flame retardants must also meet the <=1000ppm threshold requirement.

(3) MSL, Peak Temp. - The Moisture Sensitivity Level rating according to the JEDEC industry standard classifications, and peak solder temperature.

(4) There may be additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category on the device.

(5) Multiple Device Markings will be inside parentheses. Only one Device Marking contained in parentheses and separated by a "~" will appear on a device. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two combined represent the entire Device Marking for that device.

(6) Lead finish/Ball material - Orderable Devices may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two lines if the finish value exceeds the maximum column width.

Important Information and Disclaimer: The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and continues to take reasonable steps to provide representative and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.

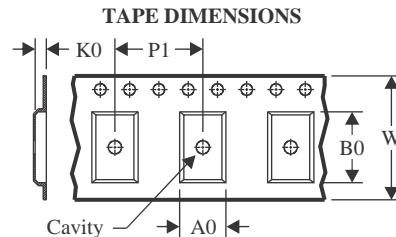
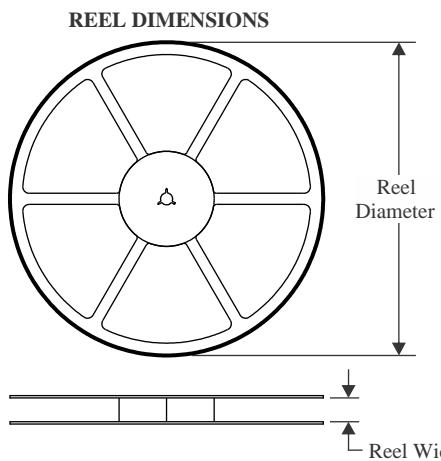
In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.

OTHER QUALIFIED VERSIONS OF SN74AHCT244-Q1 :

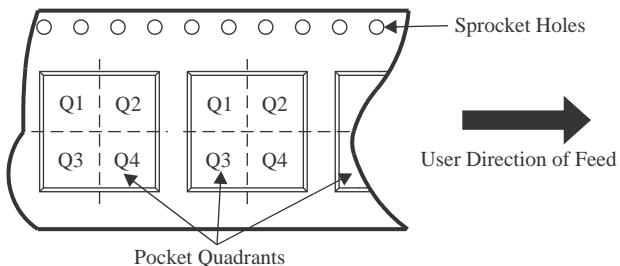
- Catalog : [SN74AHCT244](#)
- Enhanced Product : [SN74AHCT244-EP](#)
- Military : [SN54AHCT244](#)

NOTE: Qualified Version Definitions:

- Catalog - TI's standard catalog product
- Enhanced Product - Supports Defense, Aerospace and Medical Applications
- Military - QML certified for Military and Defense Applications

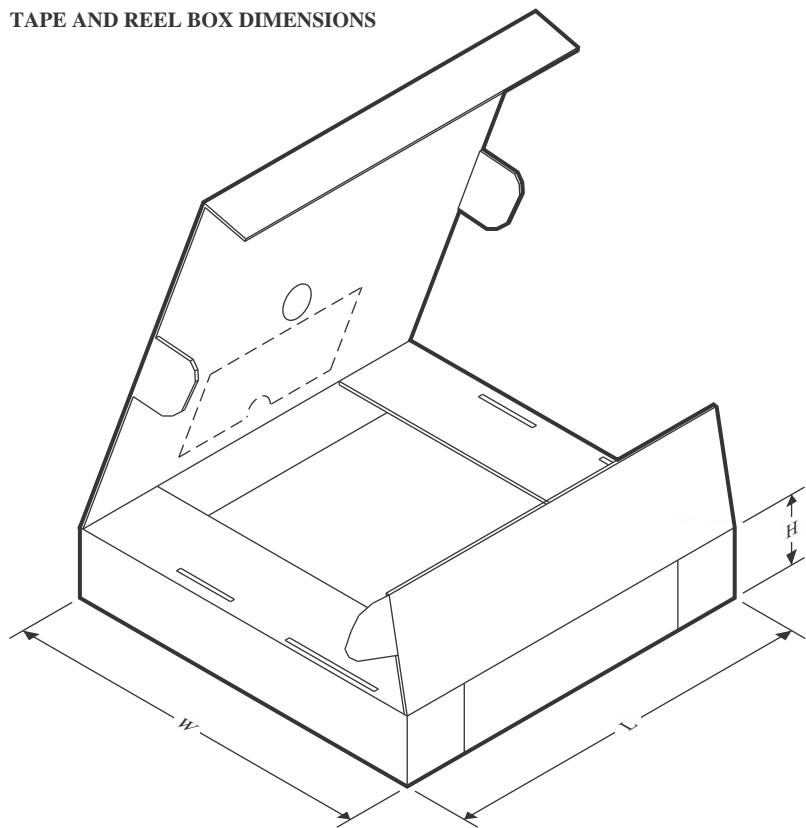
TAPE AND REEL INFORMATION

A0	Dimension designed to accommodate the component width
B0	Dimension designed to accommodate the component length
K0	Dimension designed to accommodate the component thickness
W	Overall width of the carrier tape
P1	Pitch between successive cavity centers

QUADRANT ASSIGNMENTS FOR PIN 1 ORIENTATION IN TAPE

*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Reel Diameter (mm)	Reel Width W1 (mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	P1 (mm)	W (mm)	Pin1 Quadrant
CAHCT244IPWRG4Q1	TSSOP	PW	20	2000	330.0	16.4	6.95	7.0	1.4	8.0	16.0	Q1
CAHCT244IPWRG4Q1	TSSOP	PW	20	2000	330.0	16.4	6.95	7.0	1.4	8.0	16.0	Q1
CAHCT244QDWWRG4Q1	SOIC	DW	20	2000	330.0	24.4	10.8	13.3	2.7	12.0	24.0	Q1
CAHCT244QPWRG4Q1	TSSOP	PW	20	2000	330.0	16.4	6.95	7.0	1.4	8.0	16.0	Q1
SN74AHCT244IPWRQ1	TSSOP	PW	20	2000	330.0	16.4	6.95	7.0	1.4	8.0	16.0	Q1
SN74AHCT244QDWWRQ1	SOIC	DW	20	2000	330.0	24.4	10.8	13.3	2.7	12.0	24.0	Q1
SN74AHCT244QPWRQ1	TSSOP	PW	20	2000	330.0	16.4	6.95	7.1	1.6	8.0	16.0	Q1

TAPE AND REEL BOX DIMENSIONS


*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)
CAHCT244IPWRG4Q1	TSSOP	PW	20	2000	353.0	353.0	32.0
CAHCT244IPWRG4Q1	TSSOP	PW	20	2000	356.0	356.0	35.0
CAHCT244QDWRG4Q1	SOIC	DW	20	2000	367.0	367.0	45.0
CAHCT244QPWRG4Q1	TSSOP	PW	20	2000	356.0	356.0	35.0
SN74AHCT244IPWRQ1	TSSOP	PW	20	2000	356.0	356.0	35.0
SN74AHCT244QDWQRQ1	SOIC	DW	20	2000	367.0	367.0	45.0
SN74AHCT244QPWRQ1	TSSOP	PW	20	2000	356.0	356.0	35.0

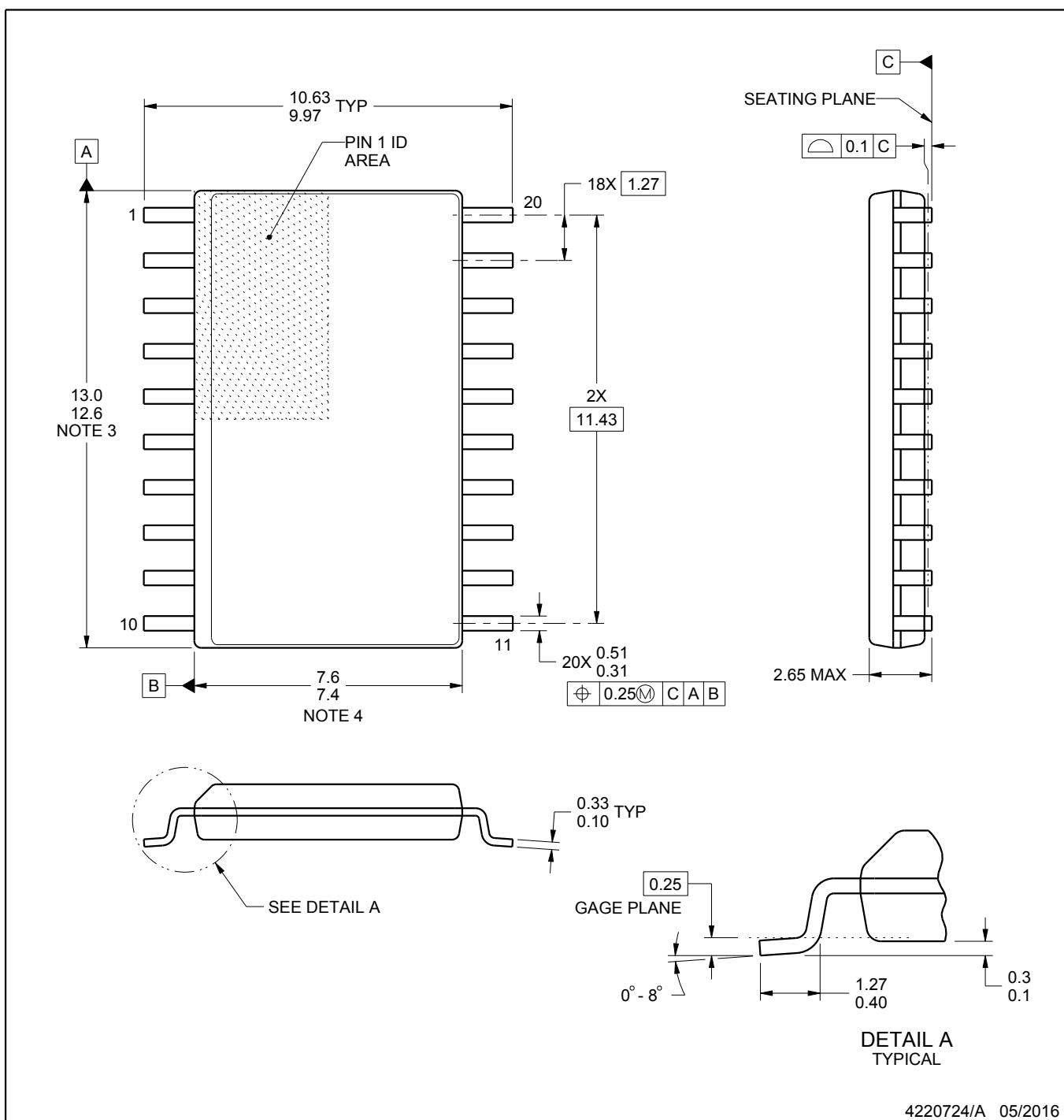
PACKAGE OUTLINE

DW0020A



SOIC - 2.65 mm max height

SOIC



NOTES:

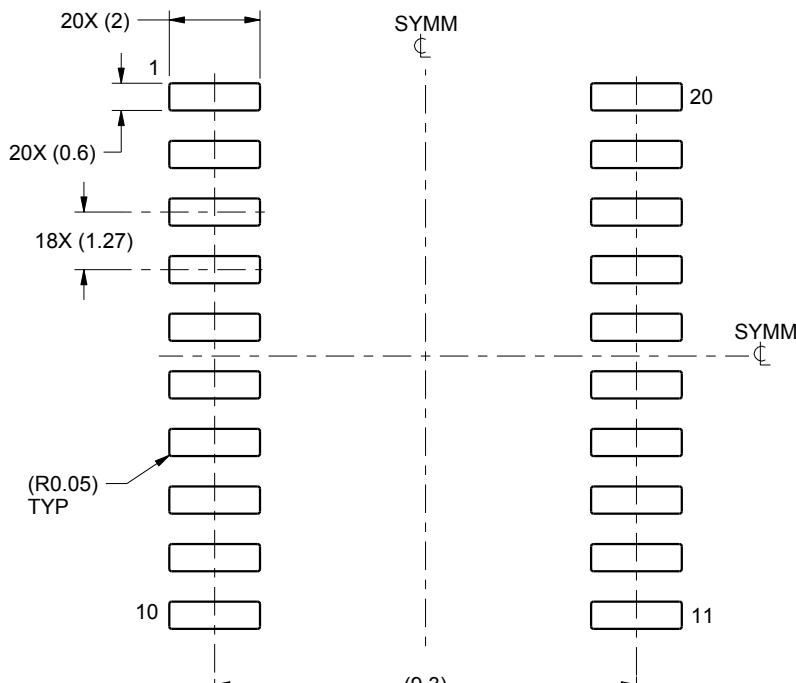
- All linear dimensions are in millimeters. Dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
- This drawing is subject to change without notice.
- This dimension does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed 0.15 mm per side.
- This dimension does not include interlead flash. Interlead flash shall not exceed 0.43 mm per side.
- Reference JEDEC registration MS-013.

EXAMPLE BOARD LAYOUT

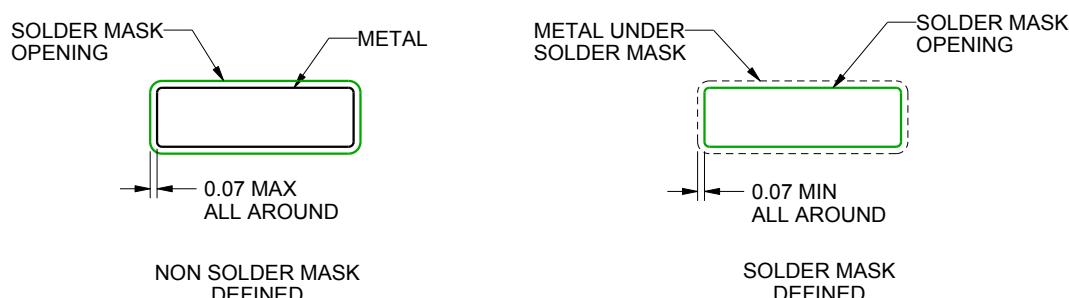
DW0020A

SOIC - 2.65 mm max height

SOIC



LAND PATTERN EXAMPLE
SCALE:6X



SOLDER MASK DETAILS

4220724/A 05/2016

NOTES: (continued)

6. Publication IPC-7351 may have alternate designs.

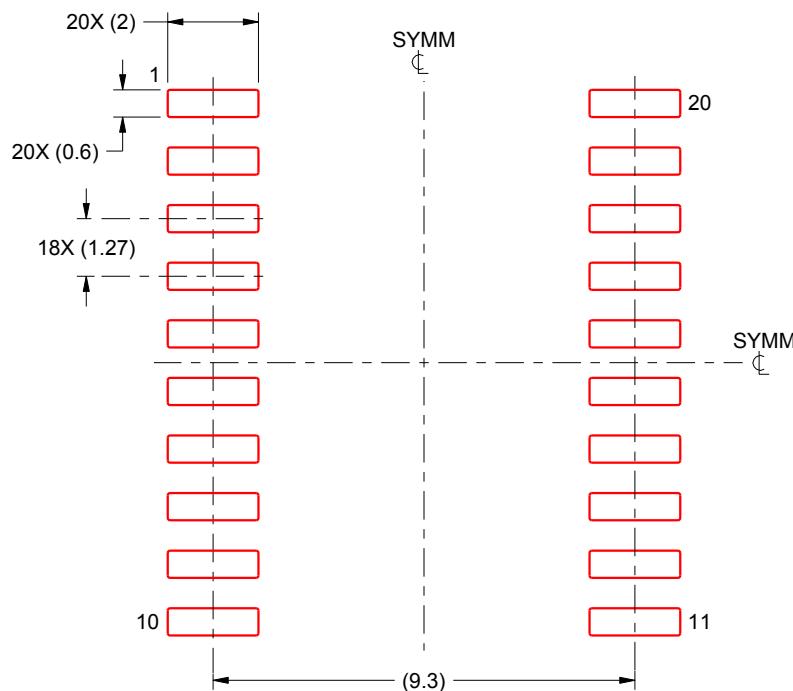
7. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.

EXAMPLE STENCIL DESIGN

DW0020A

SOIC - 2.65 mm max height

SOIC



SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.125 mm THICK STENCIL
SCALE:6X

4220724/A 05/2016

NOTES: (continued)

8. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
9. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.

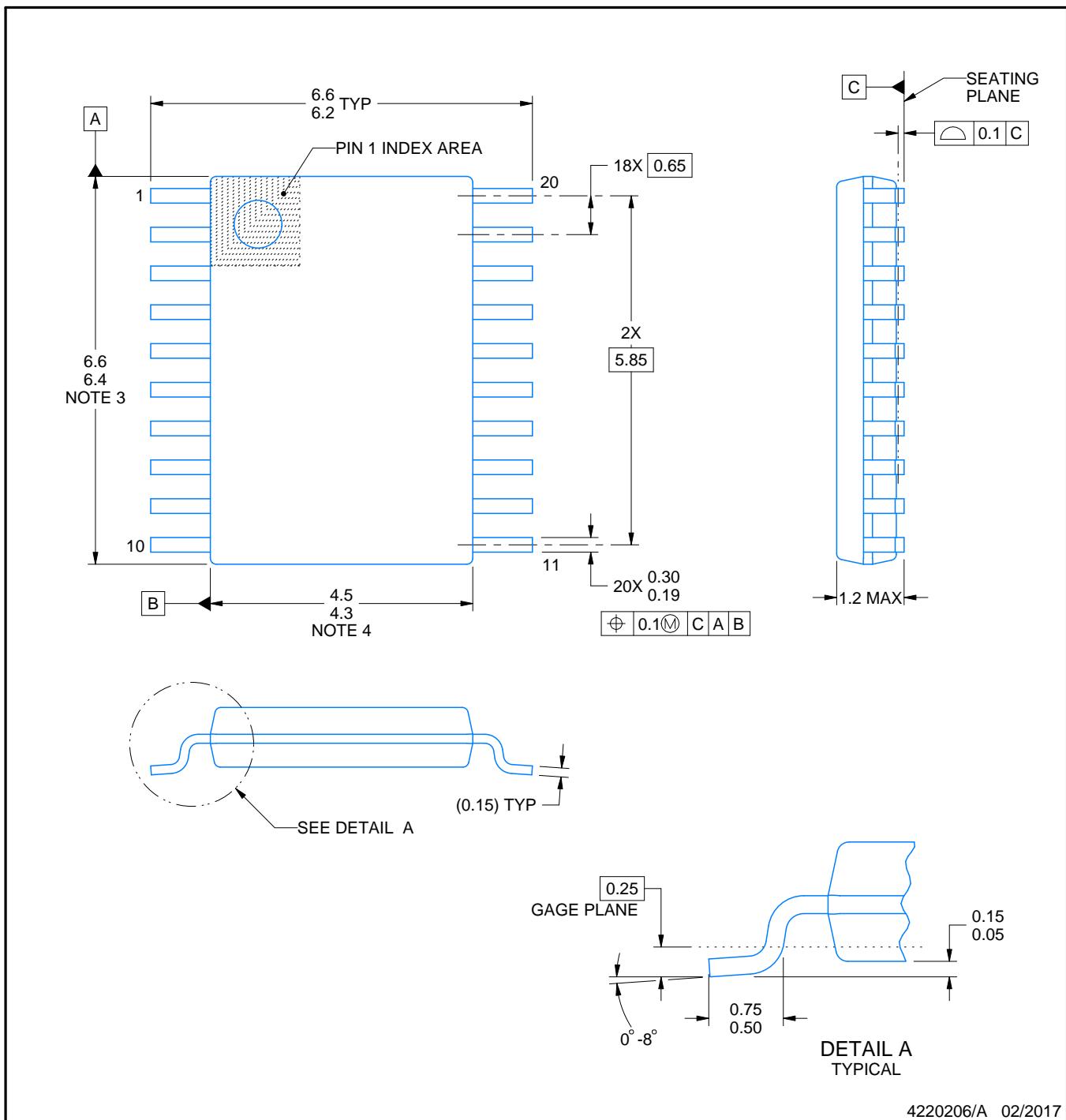
PACKAGE OUTLINE

PW0020A



TSSOP - 1.2 mm max height

SMALL OUTLINE PACKAGE



NOTES:

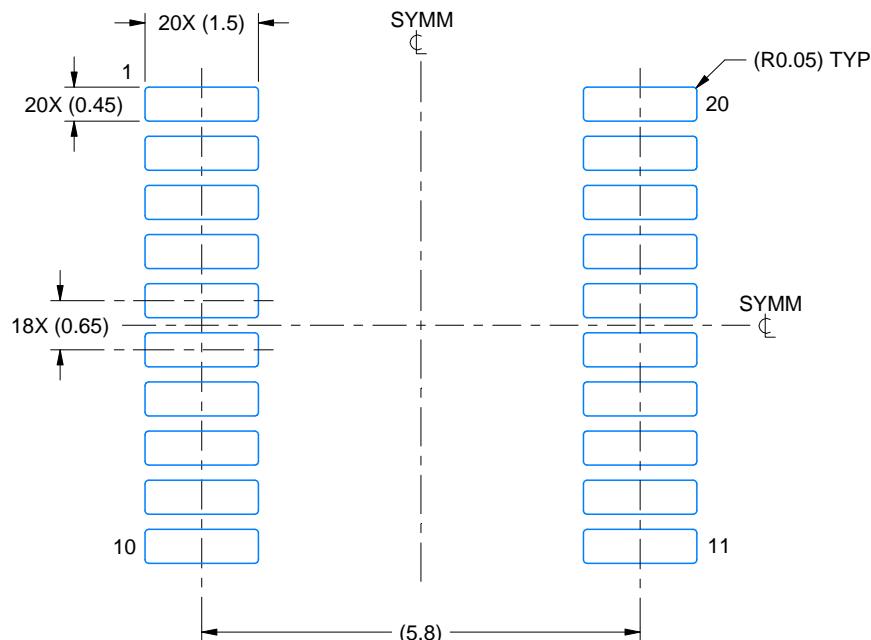
- All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
- This drawing is subject to change without notice.
- This dimension does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed 0.15 mm per side.
- This dimension does not include interlead flash. Interlead flash shall not exceed 0.25 mm per side.
- Reference JEDEC registration MO-153.

EXAMPLE BOARD LAYOUT

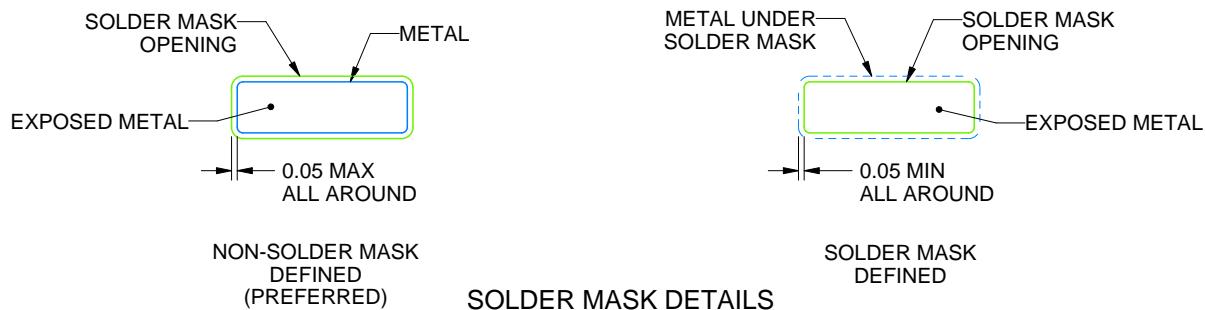
PW0020A

TSSOP - 1.2 mm max height

SMALL OUTLINE PACKAGE



LAND PATTERN EXAMPLE
EXPOSED METAL SHOWN
SCALE: 10X



4220206/A 02/2017

NOTES: (continued)

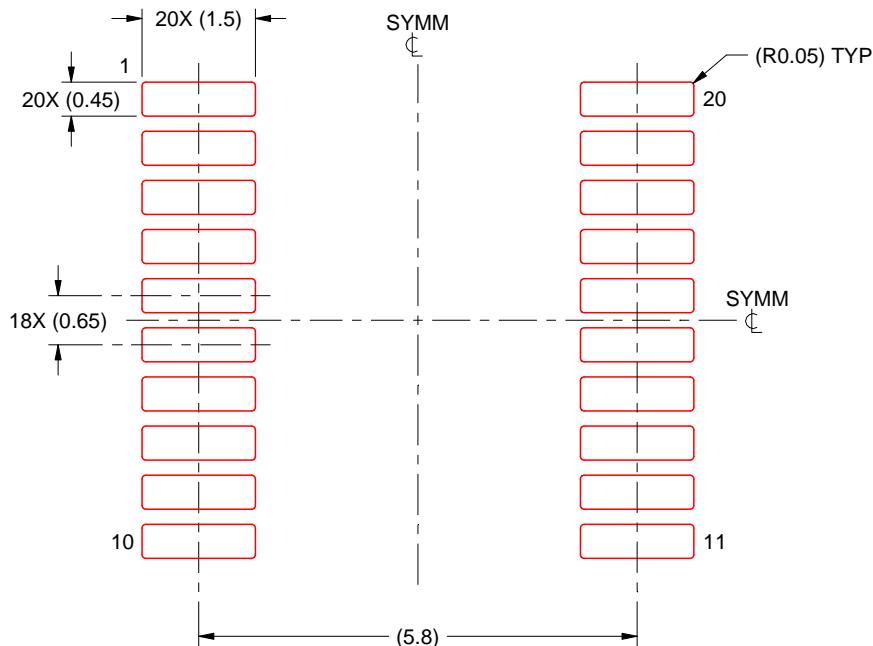
6. Publication IPC-7351 may have alternate designs.
7. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.

EXAMPLE STENCIL DESIGN

PW0020A

TSSOP - 1.2 mm max height

SMALL OUTLINE PACKAGE



SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.125 mm THICK STENCIL
SCALE: 10X

4220206/A 02/2017

NOTES: (continued)

8. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
9. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.

重要なお知らせと免責事項

テキサス・インスツルメンツは、技術データと信頼性データ(データシートを含みます)、設計リソース(リファレンス デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の默示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または默示的にかかわらず拒否します。

これらのリソースは、テキサス・インスツルメンツ製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したものです。(1)お客様のアプリケーションに適したテキサス・インスツルメンツ製品の選定、(2)お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3)お客様のアプリケーションに該当する各種規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとします。

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されているテキサス・インスツルメンツ製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、テキサス・インスツルメンツはその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。テキサス・インスツルメンツや第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、テキサス・インスツルメンツおよびその代理人を完全に補償するものとし、テキサス・インスツルメンツは一切の責任を拒否します。

テキサス・インスツルメンツの製品は、[テキサス・インスツルメンツの販売条件](#)、または ti.com やかかるテキサス・インスツルメンツ製品の関連資料などのいずれかを通じて提供する適用可能な条項の下で提供されています。テキサス・インスツルメンツがこれらのリソースを提供することは、適用されるテキサス・インスツルメンツの保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案した場合でも、テキサス・インスツルメンツはそれらに異議を唱え、拒否します。

郵送先住所 : Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265
Copyright © 2025, Texas Instruments Incorporated